



PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

Neues Labor
Feldkirchen
KOMBINATION
XPS & TOF-SIMS

NanoX-Pert NanoScience

Im Fokus:

Oberflächen und Grenzflächenanalytik

Interdisziplinäre Technologien für die komplexen und zukunftsweisenden Forschungs- und Entwicklungsfelder der Materialwissenschaften und Werkstoffkunde

Leitung: Stefan Reichlmaier

Termin: 16.10.2019

Ort: 85622 Feldkirchen bei München, Salzstraße 8
Physical Electronics GmbH



PHI GmbH's INHOUSE Seminare 2019/2020:

Sharing X-Perience mit NanoX-Pert

NanoX-Pert Advanced Materials (April 2020)

NanoX-Pert Life Science (Oktober 2020)

Das Seminar ist kostenlos, inklusive Catering und Informationsmaterial. Zur Teilnahme müssen alle Teilnehmer registriert sein.

Registrierung mittels E-Mail: szauzig@phi-europe.com

Registrierung bis 04.10.2019

Name

Firma

Abteilung/Position

Straße

PLZ; Ort

Tel./Fax

E-Mail

Die Datenschutzerklärung <https://phi-gmbh.eu/privacy-policy/> habe ich zur Kenntnis genommen.

Speicherung der Daten

Ja, hiermit bestätige ich das Physical Electronics GmbH im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen, meine persönlichen Daten elektronisch speichern darf. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Datum, Unterschrift

Die Agenda des Tages:

09:00 Registrierung
09:15 Begrüßung und Einleitung

09:30 Anwendungsbeispiele:
Warum High End Analysis?
10:00 Vorstellung der Methode ToF-SIMS
Vorstellung der Methode XPS

11:00 Kaffeepause

11:20 Vorstellung AES (Tobias Weingärtner / KIT)

12:00 Mittagessen (Buffet)

13:00 Praktischer Teil (3 Gruppen á 20 min)
ToF-SIMS; XPS und AES

14:15 Die Magie ist die Kombination XPS & TOF-SIMS

14:45 Vorstellung Submicron IR & Raman Microscopie

15:05 Kaffeepause

15:20 Die Neuesten Entwicklungen im Bereich
Oberflächenanalytik: XPS Optionen: UPS, LEIPS &
REELS; Methoden: HAXPES/XPS und TOF-SIMS mit
Parallel Tandem MS

15:55 Zusammenfassung:
Testmessungsgutschein & Feedback

16:00 Kaffeepause + Möglichkeit zur Diskussion Ihrer
individuellen Fragestellung

16:30 Ende des Seminars

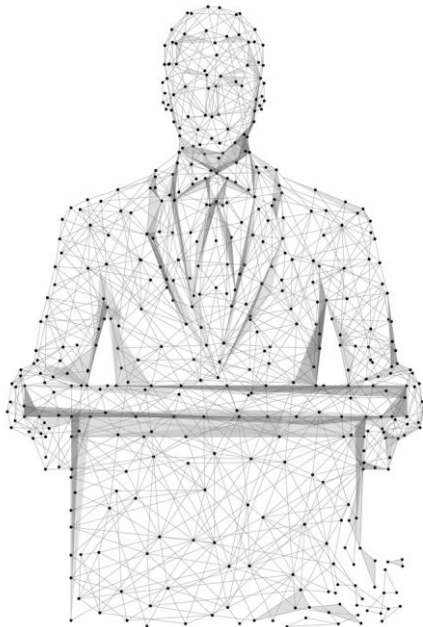
Zielsetzung:

Dieses Seminar vermittelt Ihnen durch eine interdisziplinäre Herangehensweise einen Überblick über die wichtigsten nanoanalytischen Methoden und gibt Ihnen einen ersten Eindruck.

Wie bewerten Sie als Experte das Alterungsverhalten von Beschichtungen? Haben Optimierungen und Maßnahmen funktioniert?

Das Seminar stellt Ihnen analytische Nachweisverfahren für die Untersuchung von Nanoschichten oder z.B. zur Fehleranalytik und Qualitätskontrolle, vor.
Für die Detektion organischer Substanzen auf Oberflächen mit höchster Empfindlichkeit ist TOF-SIMS die etablierte Analysenmethode.

Freuen Sie sich auf die Vorstellung der neuesten Geräteentwicklungen, in der Oberflächenanalytik! Unser Seminar, genau das Richtige für Sie.



Kontaktinformationen:

Anmeldung zum kostenlosen Seminar inklusive Testmessungs-Gutschein für Neukunden, Verpflegung während des Seminars sowie Unterlagen zum Themengebiet.
Ihre Anmeldung richten Sie bitte per E-Mail, auf dem Postweg bzw. per Telefon oder Fax an:

Physical Electronics GmbH

z. Hd. Stefanie Zauzig

Salzstraße 8

D-85622 Feldkirchen bei München

TEL. +49/89/96 275-0

FAX +49/89/96 275-50

Email szauzig@phi-europe.com

URL www.phi-gmbh.eu

Auch bei sonstigen Fragen zum Seminar steht Ihnen Frau Zauzig gerne zur Verfügung.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt, darum bitten wir Sie, sich rechtzeitig anzumelden.
Sie können leider nicht teilnehmen?
Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial über alternative Termine zu.



PHYSICAL ELECTRONICS GMBH

XPS (Röntgenphotoelektronenspektroskopie)



TOF-SIMS (Sekundärionenmassenspektrometrie)



AES (Augerelektronenspektroskopie)



XPS/HAXPES (Hart-/Weichröntgen-Photoelektronenspektroskopie)



O-PTIR (Optische Photothermische IR Spektroskopie)

